X آشکارسازی و جذب اشعه

هدف آزمایش:

آشنایی با روش تولید اشعه X

آشنایی با روش آشکارسازی اشعه X

بررسی وابستگی شدت عبوری اشعه X به ضخامت مانع

بررسی وابستگی شدت عبوری اشعه X به عدد اتمی (نوع) مانع



۱– تولید اشعه X:

امروزه میدانیم که امواج الکترومغناطیسی نوسانات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هستند که آنها را بر اساس بازههای فرکانسی دستهبندی میکنیم. شکل ۱ این مطلب را نشان میدهد و در آن طول موج اشعه X در حدود آنگستروم مشخص است. اشعه X بعد از اشعه گاما پر انرژی ترین اشعه الکترومغناطیسی است که تا امروزه میشناسیم؛ لذا اشعه خطرناکی است و انسان نباید در معرض آن قرار بگیرد. مهم ترین روش تولید اشعه X کند شدن الکترونهای پر انرژی در اثر برهم کنش با ماده است. بر اساس دینامیک برخورد، انرژی کاسته شده از الکترون به صورت فوتون تابش می شود و طیف پیوسته اشعه X را ایجاد می کند. روش دیگر تولید اشعه X، تولید فوتون در بازگشتن الکترون از حالتهای برانگیخته پر انرژی به حالتهای کم انرژی تر است. از آنجا که تفاوت انرژی تراز الکترونها در اطراف هسته گسسته است، طیف اشعه X در این حالت گسسته خواهد بود.

در شکل ۲ نمای یکی از ساده ترین لامپهای تولید اشعه X که در این آزمایش از آن استفاده می شود، نشان داده شده است.

۲- آشکارسازی اشعه X:

چشم ما نیز خود یک آشکارساز است؛ اما تنها بازهای کوچک از امواج الکترومغناطیسی را به خوبی آشکار می کند که آن را به نام *ناحیه مرئی* میشناسیم (شکل ۱). برای آشکارسازی اشعه X در این آزمایش از آشکارسازی به نام آشکارساز گایگر استفاده می کنیم. گایگر(سال ۱۹۲۵) یک شیمی دان آلمانی بود که برای اولین بار آشکارساز خود را برای آشکارسازی ذرات آلفا پیشنهاد کرد. از آنجا که این آشکارساز به راحتی قابل ساخت و استفاده برای دیگر اشعهها بود، سریع جای خود را در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی باز کرد. آشکارساز گایگر از دو استوانه هم محور تشکیل شده است و اختلاف پتانسیلی بین این دو استوانه بر قرار است (شکل ۳). در حالت عادی به دلیل عایق بودن گاز داخل استوانه هیچ جریانی از مدار عبور نمی کند. قاعده استوانه با پرده بسیار نازکی از جنس میکا پوشانده شده که ارتباط گاز درون محیط استوانه را با بیرون قطع میکند. چنانچه یک فوتون یا ذرهای از میکا وارد استوانه شود و انرژی آن در حد انرژی یونیزاسیون گاز درون استوانه باشد، گاز یونیزه شده و بدین ترتیب در لحظه بسیار کوتاهی انبوهی از بارهای مثبت و منفی بوجود خواهد آمد. به دلیل اختلاف پتانسیل خارجی اعمال شده (یک اختلاف پتانسیل DC اعمال میکنیم) یک پالس جریان در مدار اتفاق میافتد که می توان با شمردن این پالسها و یا اندازه گیری جریان عبوری از مدار، معیاری از تعداد فوتونهایی که به آشکارساز رسیده، داشته باشیم. این شمارش توسط یک شمارنده انجام می گیرد. جریان عبوری به پتانسیل اعمال شده نیز بستگی دارد. هرچه این اختلاف پتانسیل بیشتر باشد، جریان عبوری بیشتر خواهد بود. اما در یک ناحیه خاص از ولتاژ این بستگی به حداقل خود می رسد و رابطه جریان بر حسب اختلاف پتانسیل خطی تقریبا راست می شود (شکل۴) که این ناحیه مطلوب کار کردن آشکارساز می باشد (چرا؟).

۳- جذب اشعه X:

شدت امواج الکترومغناطیسی به صورتهای مختلف میتواند کاهش یابد که از چهار حالت زیر خارج نمیباشد:

- ۱- فوتوالکتریک (جذب کامل یک فوتون و انتقال انرژی آن به الکترون)
- ۲- کامپتون (پراکندگی فوتون که منجر به کاهش انرژی فوتون خروجی میشود)
 - ٣- تامسون (پراکندگی الاستیک فوتون بدون کاهش انرژی فوتون خروجی)
 - ۴- تولید زوج (تبدیل حداقل دو فوتون (چرا؟) به حداقل یک ذره و پاد ذره)

باید توجه داشت که در پدیده تامسون انرژی فوتون اولیه و ثانویه تفاوت ندارند، اما جهت پرتوی اولیه و ثانویه متفاوت است؛ لذا در عمل فوتون ثانویه از باریکه اصلی جدا شده و شدت پرتو را کاهش میدهد. در حقیقت تامسون همان پدیده کامپتون است که برای هستههای سنگین اتفاق میافتد. حال آنچه برای ما در این آزمایش مهم است، تاثیر مجموع این پدیدههاست که آن را به دو صورت بررسی میکنیم:

الف) وابستگی به ضخامت ماده:همانطور که بدیهی به نظر میرسد، توقع داریم که شدت عبوری از یک مانع مادی به ضخامت آن بستگی عکس داشته باشد. سوال این است که این بستگی چگونه میباشد؟ آنچه تئوری الکترومغناطیس پیشبینی میکند، رابطه نمایی است که ضریب نما به جنس ماده بستگی دارد:

که در آن 0شدت اولیه و κ ضریب جذب است.

ب) وابستگی به نوع ماده: همانطور که در قسمت قبل نیز بیان شد، ضریب جذب به نوع ماده بستگی دارد. در حقیقت ضریب جذب تابعی از فرکانس و جنس ماده است $\kappa = \kappa(\omega,n)$ (چرا؟). البته این بستگی پیچیدگیهای فراوانی دارد و در حوزه فیزیک ماده چگال مبحث مفصلی را به خود اختصاص میدهد؛ اما با در نظر گرفتن کلیات میتوان رابطه نسبی را برای بستگی κ به عدد اتمی مانع بدست آورد. به نظر شما با افزایش κ عدد اتمی مانع، شدت عبوری از مانع کم میشود یا زیاد؟ در این آزمایش درستی یا غلطی حدس خود را خواهید دید.

وسايل آزمايش:

وسایل این آزمایش را می توان به سه بخش اصلی محفظه تولید اشعه و آشکارساز گایگر، دستگاه تنظیم ولتاژ و تقویت گایگر و شمارنده تقسیم کرد.

ا محفظه تولید اشعه و آشکارساز گایگر:

شکل ۵ و ۶ جزئیات دستگاه تولید اشعه X را نشان می دهند.

*ودر کار کردن با اشعه X همیشه باید از قرار گرفتن در معرض تشعشع پرهیز کنید. به همین دلیل دستگاه تنها در حالت دربسته کار میکند. اگر در را باز کنید دستگاه خاموش میشود.

روش کار: بعد از اتصال دستگاه به برق و در حالت دربسته U_A و U_{em} کمینه کنید و دکمه روشن دستگاه را بزنید و سپس ولتاژ U_A جریان U_{em} بازید و سپس ولتاژ U_A و جریان U_{em} بازید و سپس ولتاژ و بازی به مقدار دلخواه تنظیم کنید.

 \bullet در صورتی که دکمه روشن دستگاه را در ولتاژی غیر از کمینه U_A فشار دهید، دستگاه روشن نخواهد شد (نشانه روشن شدن دستگاه روشن شدن چراغ قرمز روی دستگاه است). لذا حتماًابتدا دستگاه را در U_A = U_A =U

🗢 تایمر دستگاه را روی ۱۲۰ دقیقه بگذارید و در صورت نیاز آن را تمدید کنید.

فراموش نکنید که ولتاژ واقعی U_A که روی دستگاه با اعداد ۱ تا ۷ میبینید را با ولتمتر تعیین کنید. ولتاژی که اندازه گیری می کنید، از ولتاژ واقعی بسیار کوچکتر است (چرا؟). پس برای تصحیح باید آن را در $\sqrt{2}$ $000 \times \sqrt{2}$

۲- دستگاه تنظیم ولتاژ و تقویت گایگر(شکل ۷)

ولتاژ اعمالی کل از مجموع دو ولتاژ، از طریق تنظیم دو ولتاژ، یکی پیوسته و دیگری گسسته حاصل میشود.

۳- شمارنده

همانطور که قبلاً طرز کار آشکارساز گایگر توضیح داده شد، گایگر خروجی پالسی دارد که میتوان با تقویت و تبدیل به صوت با بلندگو داده گرفت. اما اگر تعداد این پالسها زیاد باشد، نیاز به یک شمارنده داریم. این شمارنده و اجزای آن در شکل۵ از آزمایش رادرفورد قابل مشاهده می باشد.

دیگر وسایل، ورقه زیرکونیم، دو نوع جذب کننده پرتو X که یکی با ضخامتهای مختلف آلومینیم و دیگری از عناصر مختلف میباشد.

شرح آزمایش:

آزمایش ۱: بررسی ناحیه کار گایگر و کالیبره کردن آن

همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، گایگر در یک محدوده پتانسیلی مطلوب کار می کند و فقط در این ناحیه جریان تقریبا به پتانسیل اعمالی بستگی ندارد (چرا؟). برای این آزمایش دستگاه تولید اشعه x و آشکارساز گایگر را طبق دستورالعمل توضیح داده شده در وسایل آزمایش روشن نمایید. فیلتر زیر کونیوم را جلوی منبع اشعه x قرار داده (شکل x) و x و ولتاژ آشکارساز گایگر را از کمینه تا بیشینه زیاد کنید و جریان رسیده به آشکارساز را اندازه بگیرید.

- ▼ همانگونه که قابل حدس است، نقش زیرکونیوم (Z=40) فیلتر کردن اشعه X است. به طوری که از مشخصه فرکانسی برخوردار است که امواج با طول موج حدود ۰/۷۱ آنگستروم را به خوبی عبور میدهد. این موضوع در آزمایش کامپتون کاملتر توضیح داده شده است.
 - 🗢 ولتاژ گایگر حاصل از جمع دو ولتاژ روی دستگاه یکی از ۰ تا ۵۴۰ ولت و دیگری از ۰ تا ۲۰۰ ولت میباشد.
 - 🗢 پس از تعیین ولتاژ گایگر، برای بقیه آزمایشها از آن استفاده کنید.

آزمایش ۲: بررسی شدت عبوری به ضخامت مانع:

آشکارساز را در زاویه صفر درجه بگذارید و مانع آلومینیومی با ضخامتهای متفاوت را روی قسمت هدف ببندید (شکل ۹). فیلتر زیرکونیوم را نیز جلوی آشکارساز بگذارید. ولتاژ U_A را بر روی ۷ تنظیم نمایید و شدت رسیده به آشکارساز را برای ضخامتهای مختلف اندازه گیری کنید. دادهها را در جدول ۱ قرار دهید.

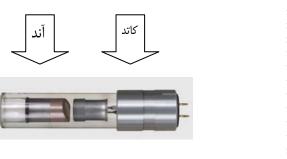
▼ در هم راستا بودن آشکارساز و مانع آلومینومی با راستای اشعه دقت کنید. چرا که اگر کمی هدف از نقطه
مطلوب جابجا شود، باعث عدم دقت در ضخامت ماده و بدست آمدن نتایج غیر دقیق می شود.

آزمایش ۳: بررسی شدت عبوری به نوع مانع:

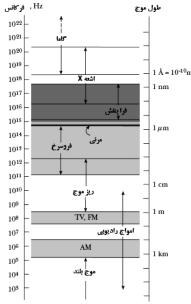
آشکارساز را در زاویه صفر درجه بگذارید و مانع با مواد متفاوت را روی قسمت هدف ببندید و فیلتر زیرکونیوم را نیز جلوی آشکارساز بگذارید. ولتاژ U_A را بر روی ۷ تنظیم نمایید و شدت رسیده به آشکارساز را برای مواد مختلف اندازه گیری کنید. نتایج را در جدول ۲ قرار دهید.به نکته مورد تذکر در آزمایش قبل توجه نمایید.

در آزمایشهای ۲ و 7 اندازه گیری I_0 فراموش نشود. همچنین اندازه گیری مقدار واقعی ولتاژ آند فراموش نشود. lacktree

تصاوير:

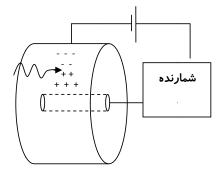


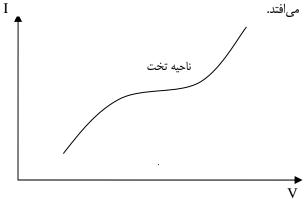
شکل ۲. شکلی از لامپ اشعه X، الکترونها پس از شتاب گرفتن از کاتد، به آند که معمولا از جنس مولیبدن و یا مس است برخورد می کنند و اشعه X تولید می شود.



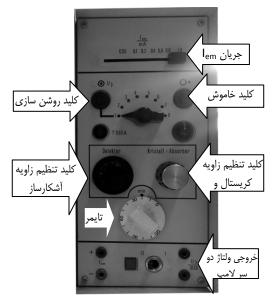
شکل ۱. دستهبندی حوزههای امواج الکترومغتاطیسی

شکل ۳. شماتیکی از نحوه کار شمارنده و آشکارساز گایگر. به محض ورود یک فوتون پر انرژی به محفظه آشکارساز، گاز داخل استوانه یونیزه شده و به دلیل اختلاف پتانسیل خارجی که اعمال شده، یک پالس جریان در مدار اتفاق می افتد.

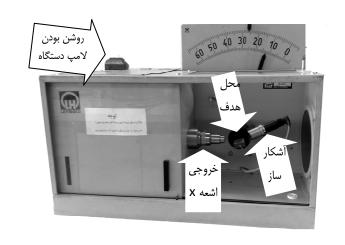




شکل ٤. نمودار جریان عبوری از گایگر بر حسب ولتاژ وناحیه مطلوب کار آن



شکل ٦. پنل تنظیمات محفظه تولید اشعه و چشم گایگر



شکل ٥. محفظه تولید اشعه و چشم گایگر



شکل ۸. ورقه زیرکونیم در مسیر پرتو اشعه X



شکل ۷ .دستگاه تنظیم ولتاژ و تقویت گایگر



شکل ۹. ضخامتهای مختلف آلومینیم در مسیر پرتو اشعه x و در مقابل آشکارساز گایگر

جداول و دادهها:

جدول ۱ شدت دریافتی پس از عبور اشعه X از ضخامتهای مختلف آلومینیم.

ضخامت(mm) ا	٠/۵	١	١/۵	۲	۲/۵	٣
بار اول						
بار دوم						
بار سوم						
شدت میانگین						

جدول۲ شدت دریافتی پس از عبور اشعه X از فلزات مختلف.

عدد اتمي ا	۶	١٣	75	79	۴٠	۴٧
شدت						

پرسشها:

در زمان انجام آزمایش به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. با استفاده از آزمایش اول منحنی شدت رسیده به آشکارساز بر حسب ولتاژ گایگر را رسم کنید. هر ناحیه را
تفسیر کرده و ناحیه کار گایگر را مشخص کنید. چرا در آزمایشهای بعدی از این ناحیه استفاده می کنید؟

۲. با افزایش ضخامت ورقه آلومینیمی شدت اشعه X چه تغییری می کند؟

۳. آیا شدت دریافتی پس از عبور اشعه X از فلزات مختلف روندی منطقی دارد؟ نتایج را تفسیر کنید.

پاسخ سوالات زیر را در جلسه بعد تحویل دهید.

۱- با استفاده از دادههای جدول ۱ منحنی I/I_0 را بر حسب ضخامت آلومینیم در یک کاغذ نیملگاریتمی رسم کنید. منحنی را تفسیر کنید. (ضریب جذب را برای طول موج $0.71A^\circ$ بهدست آورید.)

- ۲- با استفاده از دادههای جدول ۲ منحنی I/I_0 را بر حسب عدد اتمی رسم کنید و منحنی را تفسیر کنید.
 - ۳- عوامل خطا را ذکر کنید. خطای سیستماتیک را وارد نتیجه آزمایش کنید.
 - ۴- نحوه ایجاد و کاربردهای اشعه x را توضیح دهید.
 - ۵- از بررسی جذب اشعهx چه کمیاتی را میتوان یافت؟ نتایج این آزمایش چه کاربردهایی دارد؟
 - ۶- آیا جذب اشعهx به طول موج بستگی دارد؟ توضیح دهید.
 - ۷- پالسهای زمینه ناشی از چه منابعی هستند؟

۸- فوتونها از طریق چهار فرایند متفاوت می توانند با اتمهای یک ورقه برهم کنش داشته باشند: فوتوالکتریک، تولید زوج، تامسون، کامپتون. دو فرایند اول فوتونها را کاملا جذب می کنند، در حالی که دو فرانید آخر تنها آنها را پراکنده می کنند. البته تمام فرایندها فوتونها را از باریکه ی موازی دور می سازند. اینکه تحت مجموعهای از شرایط مفروض شانس وقوع کدام فرایند بیشتر است، از اهمیت نظری و عملی قابل توجهی برخوردار است. این شانس یا احتمال وقوع با چهار سطح مقطع بیان می شود.

الف) در مورد مفاهیم سطح مقطع پراکندگی، سطح مقطع فتوالکتریک، سطح مقطع تولید زوج و سطح مقطع کل بحث کنید.

کنید.	تفسير	ان را	کرده و	رسم	فرودى	فوتون	انرژی	حسب	ع را بر	ح مقط	ر سط	ن چها	نحنی ای	ب) م
 													·*.	بادداث